

UNION TECHNIQUE DE L'ÉLECTRICITÉ

OPTOELECTRONIQUE

Additif 1
au recueil de méthodes de mesures particulières
aux dispositifs optoélectroniques

Edité par l'Union technique de l'Electricité
12, place des Etats-Unis, 75783 PARIS CEDEX 16
Téléph. : Paris (1) 723.72.57

OPTOELECTRONIC
Special measurement methods for
optoelectronic devices

OPTOELECTRONIQUE

Recueil de méthodes de mesures particulières aux dispositifs optoélectroniques

DOCUMENT UTE C 96-550 ADD 1 DE L'UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE (1)

Modifications à apporter au document UTE C 96-550

- Remplacer la liste des méthodes de mesures en vigueur du 25 avril 1979 par la liste ci-jointe
- Ajouter les méthodes de mesures suivantes, destinées aux photocoupleurs :
 - P 104/S — Courant résiduel collecteur émetteur I_{CEO}
 - P 124 — Tension de claquage collecteur émetteur $V_{(BR)CEO}$
 - P 124 bis — Tension de claquage collecteur émetteur $V_{(BR)CEO}$
 - P 124 ter — Tension de claquage cathode-anode en sortie V_{BR}
 - P 126 — Tension de claquage collecteur-base $V_{(BR)CBO}$
 - P 127 — Tension de claquage émetteur-base $V_{(BR)EBO}$
 - P 127 bis — Tension de claquage émetteur-base $V_{(BR)ECO}$
 - P 5100 — Tension d'isolement de surcharge accidentelle minimale V_{IOSM}
 - P 5101 — Tension de tenue entrées-sorties V_{IORM}
 - P 5103 — Temps de commutation d'un photocoupleur
 - C 1506 — Détection de défauts intermittents en température
 - E 1701 — Vieillessement en fonctionnement continu (classes V et T)
 - E 1703 — Vieillessement à chaud sous tension de travail
 - E 1704 — Vieillessement à chaud en fonctionnement et sous tension de travail
 - E 1705 — Vieillessement en fonctionnement continu (classe standard)

(1) Adopté le 29 avril 1980

LISTES DES METHODES DE MESURES
PARTICULIERES AUX DISPOSITIFS OPTOELECTRONIQUES

NUMERO DE LA MESURE	TITRE	PAGE	FIGURANT DANS L'ADDITIF	
			N°	ADOpte LE
L 101	Calibrage d'étalons de travail en température de couleur	5	—	25 avril 1979
L 102	Etalonnage du banc d'optique	6	—	25 avril 1979
L 103	Mesure de flux	9	—	25 avril 1979
L 104	Courant de lumière des photodiodes et phototransistors	10	—	25 avril 1979
L 105	Intensité lumineuse et intensité énergétique	12	—	25 avril 1979
L 106	Luminances lumineuse et énergétique	14	—	25 avril 1979
L 107	Longueur d'onde maximale λ_{pic} et largeur de spectre à mi-hauteur $\Delta \lambda$	17	—	25 avril 1979
L 108	Diagramme d'émission et angle à mi-intensité $\theta 1/2$	19	—	25 avril 1979
L 109	Temps de commutation d'un émetteur	22	—	25 avril 1979
L 110	Désalignement de l'axe optique par rapport à l'axe mécanique $\Delta \theta$	23	—	25 avril 1979
P 104/S	Courant résiduel collecteur-émetteur I_{CEO}	24	1	29 avril 1980
P 124	Tension de claquage collecteur-émetteur $V_{(BR)CEO}$	25	1	29 avril 1980
P 124 bis	Tension de claquage collecteur émetteur $V_{(BR)CEO}$	26	1	29 avril 1980
P 124 ter	Tension de claquage cathode-anode en sortie V_{BR}	27	1	29 avril 1980
P 126	Tension de claquage collecteur-base $V_{(BR)CBO}$	28	1	29 avril 1980
P 127	Tension de claquage émetteur-base $V_{(BR)EBO}$	29	1	29 avril 1980
P 127 bis	Tension de claquage émetteur-base $V_{(BR)ECO}$	30	1	29 avril 1980
P 5100	Tension d'isolement de surcharge accidentelle minimale V_{IOSM}	31	1	29 avril 1980
P 5101	Tension de tenue entrées-sorties V_{IORM}	33	1	29 avril 1980
P 5103	Temps de commutation d'un photocoupleur	35	1	29 avril 1980
C 1506	Détection de défauts intermittents en température	36	1	29 avril 1980
E 1701	Vieillissement en fonctionnement continu (classes V et T)	39	1	29 avril 1980
E 1703	Vieillissement à chaud sous tension de travail	42	1	29 avril 1980
E 1704	Vieillissement à chaud en fonctionnement et sous tension de travail	43	1	29 avril 1980
E 1705	Vieillissement en fonctionnement continu (classe standard)	45	1	29 avril 1980

Adoptée le 29 avril 1980

UTE

Reproduction interdite